

1. NOVA で何ができる?

本装置は、パルス中性子源の特長である幅広い波長の中性 子を利用し,幅広いQ領域を同時に観測する全散乱装置で ある.全散乱装置とは,主に熱外中性子領域(0.5~10 eV, 0.009~0.04 nm) 迄の比較的エネルギーの高い(波長の短い) 中性子を利用することによって、物質の静的構造因子 S(Q) を可能な限り大きな $Q = |Q| = (4\pi/\lambda) \sin \theta$ まで正確に測定 することを目的とする回折装置である. Q は逆格子空間に おける波数ベクトル kの変化(運動量遷移)を表し、散乱べ クトルと呼ばれる.結晶の格子面間隔 $d \ge Q$ は、 $Q=2\pi/d$ の関係がある.測定されたS(Q)をフーリエ変換することに より,実空間二体分布関数(Pair Distribution Function, PDF)を得られる. PDF における実空間分解能は、最大 Q値に逆比例するため,短い波長の中性子による高いQ値で の精度の高い S(Q) 測定が必要となる⁽¹⁾⁽²⁾. 全散乱法は, も ともとはブラッグ回折を生じないガラス、液体等の不規則系 の構造研究に適用されてきたが、近年では結晶におけるナノ メートル程度の相関の導出にも用いられている⁽³⁾.

NOVA は、広い Q 領域 $(0.1 \text{ nm}^{-1} \sim 1000 \text{ nm}^{-1})$ にわたる S(Q)が取得可能である.小角領域を含む観測が可能である ので、数十 nm 程度の相関まで観測できる.また、最高分解 能は約0.3%と設計されており、汎用的な粉末回折装置とし ても使用可能である.中性子全散乱装置としては世界最高中 性子測定強度を実現することになる⁽⁴⁾.

最大ビームサイズは 20×20 mm²である.最小ビームサイズは,5×5 mm²を予定している.微小試料での実験は,装置のノイズが小さいことが重要であり,遮蔽体の真空槽内への設置や空気層の削減等の対策を施している.試料形状は,試料環境や測定目的に対応して重要とする観測 Q 領域に応じて最適化される.NOVA は幅広い波長の中性子を使うために,限られた散乱角度による測定でもS(Q)測定が可能となる.例えば,最も短い波長として 0.012 nm の中性子が利用可能であるために,散乱角が30度までの観測により Q=250 nm⁻¹までの測定が可能である.また,散乱角が90度付近の検出器バンクだけでも,10 nm⁻¹から 800 nm⁻¹の領域

のS(Q)測定が可能である. つまり,広い散乱角の確保が難しい特殊試料環境の場合でも,S(Q)測定を行う事が可能である.

2. NOVA はどこがすごい?

図1に示すのは、高エネルギー加速器研究機構で稼働して いたパルス中性子源(KENS)に設置されていた、全散乱装置 (HIT-II)と小角・広角散乱装置(SWAN)の2台によるデー タにより作成したものである.両装置の測定領域は3nm⁻¹ ~30 nm⁻¹において重複しているが、図中には便宜的に両装 置の境界を示している.試料は、メソポーラスシリカ (FSM)である.小角領域(SWAN)には、約4.3 nmの間隔で hexagonal に配置するポアによるブラッグピークが観測さ れ、高角領域(HIT)では、骨格構造を形成するシリカガラス の構造因子が観測されている.NOVAでは、この2台の装 置分のQ領域を測定可能にした.中性子全散乱装置の世界 的な傾向としても、小角領域に拡張が進んでいる.測定時間



 図1 NOVAの測定領域のイメージ.全散乱装置 (KENS-HIT)と小角、広角散乱装置(KENS-SWAN)の2台の装置によるメソポーラスシリカ (FSM)の測定データより作成.

^{*} 高エネルギー加速器研究機構; 教授(〒305-0801 つくば市大穂 1-1) High Intensity Total Diffractometer NOVA; Toshiya Otomo(High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba) Keywords: *neutron, total diffraction, Pair Distribution Function, nano structure* 2009年3月16日受理

	ISIS GEM(英国ラザフォード・アップルトン研究所)	J-PARC NOVA
測定対象 測定領域	弾性散乱 0.4 nm ⁻¹ <q<550 nm<sup="">-1</q<550>	弾性散乱 0.1 nm ⁻¹ <q<1000 nm<sup="">-1</q<1000>
中性子波長(またはエネ ルギー)およびフラック ス	0.4 nm 以下	$0.012 \text{ nm} \sim 0.83 \text{ nm}$ $5 \times 10^8 \text{ neutron/sec}$
得られる情報	二体分布関数	同左
対象研究分野	ガラス,液体,結晶等,多様な物質の構造解析	ガラス、液体、結晶等、多様な物質の構造解析
試料サイズ	最大 40 mm×20 mm(可変)	最小 5 mm×5 mm 最大 20 mm×20 mm
特殊環境	低温(最低4K),高温(1000K)等多数	in-situ 水素貯蔵過程観測
測定時間	S(Q)測定の標準的時間:5-7時間	標準15分 最大約1時間 最短1秒以下
装置特徴	高強度	高強度,広いQ領域測定
装置運用状況	年間200日	2009年4月より装置調整を開始.2012年3月まで NEDO 委託研究.
J-PARC 関連装置		iMATERIA, 大観

表1 NOVA 何ができる? どこがすごい?

は、試料サイズや試料による中性子散乱強度、必要とされる 統計精度に依存する. とくに高いQ領域は, 試料の散乱強 度が小さいため, J-PARC においても統計精度を上げるの は容易ではない. 高エネ機構のパルス中性子源(KENS)に設 置され、ガラスや液体の実験において多くの成果を上げてき た中性子全散乱装置 HIT-II (2006年3月に稼働停止)の測定 時間を, J-PARC の中性子フラックス(J-PARC 加速器の定 格1MW 運転を仮定)で規格化すれば, NOVA において HIT-II と同程度の統計精度を得るのには5分程度と見積も られる.対称性の高い結晶粉末のブラッグピーク位置の観測 であれば、1秒以下の測定も可能と考えている. このよう に,汎用的な粉末回折装置としても十分な分解能を有しなが ら、広いQ領域を数分程度で測定可能であるのがNOVAの 特長である. このような強度利得を、イベント処理型のデー タ集積システムの採用により、外場の印可による過渡現象の 測定に生かしていく. つまり, 過渡現象におけるナノメート ル以下のスケールの構造変化を網羅的に観測したいと考えて いる.

現在稼働している代表的な中性子全散乱装置は、英国ラザフォード・アップルトン研究所 ISIS 中性子施設に設置されている GEM である⁽⁵⁾. GEM との簡単な性能比較を表1に示す. NOVA は、GEM と比較して小角領域の測定、より高い中性子フラックスが特長となる。測定時間の定量的比較は容易ではないが、NOVA は GEM の 1/6 程度と予想される. パルス中性子源以外では、第3世代放射光源を利用した高エネルギーX線回折装置、たとえば SPring-8の BL04B2 により、高いQ領域まで高精度のS(Q)測定が可能になっている.中性子とX線の全散乱実験データ(S(Q))と

g(r))に基づき,計算機上で構築するリバースモンテカルロ法(RMC法)⁽⁶⁾などの3次元構造モデリング法の発展とともに,中性子-X線の相補的利用による詳細な構造解明が可能になりつつある⁽⁷⁾.

3. NOVA を活用するために

高強度全散乱装置の建設は、NEDO「水素貯蔵材料先端基 盤研究事業」(プロジェクトリーダー:産総研・秋葉悦男氏) として進められている.2011年までの同事業期間中は,水 素貯蔵材料の構造研究が展開される.本装置は、2009年4 月より、データ解析ソフトウエアを含む装置調整を開始す る.全散乱法の基礎については文献(1)~(3)を、NOVAの 全体像については文献(4)をご覧いただきたい.

文 献

- (1) J. M. Carpenter: J. Non-Cryst. Solids, 76(1985), 1.
- $(\ 2\)\ \ K.$ Suzuki: Methods of Experimental Physics, 23B(1987) , 243.
- (3) T. Egami and S. J. L. Billinge: Underneath the Bragg Peaks-Structural Analysis of Complex Materials, Pergamon, (2003).
- (4) 大友季哉, 鈴谷賢太郎:日本結晶学会誌, 50(2008), 29-34: NOVA の全体像について,より詳細に紹介している.
- (5) A. C. Hannon: Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A, 551 (2005), 88: ISIS-GEM の紹介論文.
- (6) R. L. McGreevy and L. Pusztai: Mol. Simul. 1(1988), 359: リ バースモンテカルロ法.
- (7) S. Kohara and K. Suzuya: J. Phys.: Cond. Matter, 17 (2005), S77:高エネルギーX線回折装置の紹介とX線-中性子線の相 補的利用.